

特徴

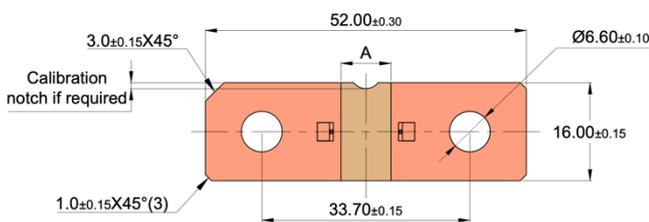
- 銅端子の優れた導電性
- 優れた長期安定性
- 高いピーク電力に対する耐性
- RoHS、REACH認証
- AEC-Q200 認証
- 要求ベースでカスタム対応も可能
- 要求ベースでピン形状のカスタム対応も可能
- 要求ベースで銅端子部のメッキ対応も可能



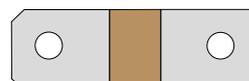
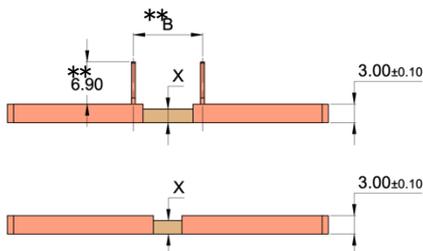
アプリケーション

- xEVのバッテリー管理システムの電流検出
- バスバーの電流検出
- 溶接機の電流検出

抵抗値公差 (R)		
TCR - 抵抗合金 (20-60°C)		
TCR - 部品 (20-60°C)		
使用温度範囲	65 ~ +170	
定格電力	15	
インダクタンス	< 5	
熱起電力	< 1	
耐久性	< 0.5 (2000時間後), $T_t^* = 100^\circ\text{C}$	
* T_t^* = 端子温度	< 1.0 (2000時間後), $T_t^* = 130^\circ\text{C}$	%



抵抗値 (mΩ)	X ±0.10	A ±0.50	B ±0.20	Type
0.05	2.20	4.50	7.60	SBZ-5216-CM1-R00005
0.10	2.20	8.10	11.20	SBZ-5216-CM2-R0001

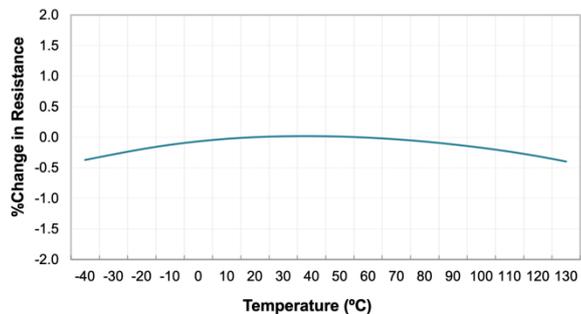


*メッキ対応

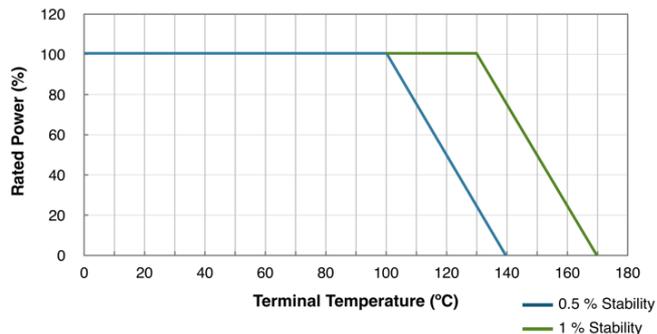
- RoHS認証のメッキ
- 標準は錫メッキ: 厚さ2.5~8 μ
- 要求ベースで、ニッケル下地0.5~4 μ m可能
- 基本材料: 無酸素銅1/2H

- 検出ピンのカスタム対応可能
- 要求ベースで8mm & 11mm高ピンの対応可能
- その他のピン高の対応も可能

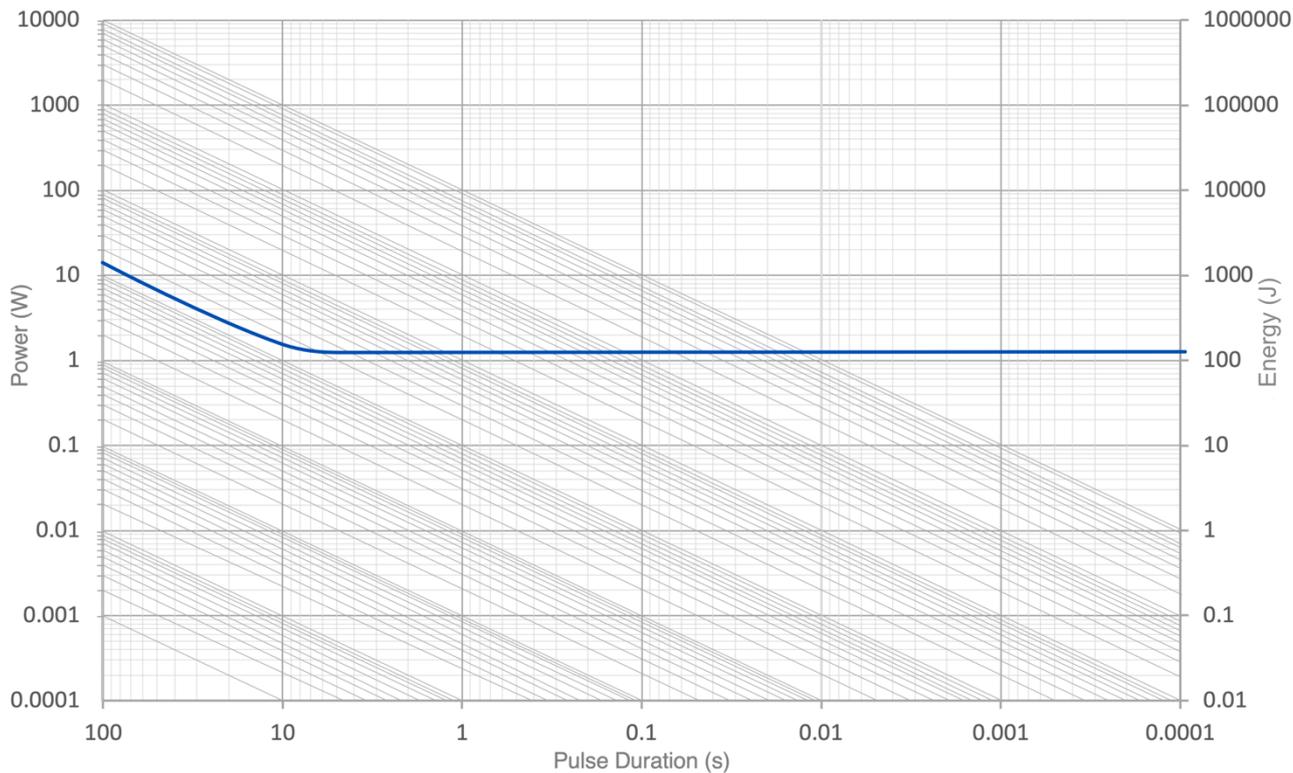
対温度抵抗値変化率



電力軽減曲線



最大パルスエネルギー曲線 (0.1 mΩ)



梱包:

- ナイロンバックに100個詰め、標準
- トレイ梱包、要求ベース
- チューブ梱包、要求ベース

SBZ 5216 シリーズ

低抵抗電子ビーム溶接精密抵抗器

特性:

試験項目	参照基準	試験条件	合格基準
高温放置	MIL-STD-202 Method 108	170°C環境で1000 時間、通電なし	ΔR +/-1%
温度サイクル	JESD22 Method JA-104	-55°C~150°C, 1000サイクル, 各30分	ΔR +/-0.5%
高温高湿バイアス	MIL-STD-202 Method 103	85°C & 湿度85%, 動作電力10%, 1000時間	ΔR +/-0.5%
高温寿命	MIL-STD-202 Method 108	定格電力下で125°C, 1000時間	ΔR +/-1%
外観	MIL-STD-883 Method 2009	目視検査	目視で異常なし
寸法	JESD22 Method JB-100	図面の寸法に従う	図面の公差内
溶剤耐性	MIL-STD-202 Method 215	水性化学物質で洗浄	レーザー刻印に影響ないこと
振動	MIL-STD-202 Method 213	100gを6ミリ秒間, 正弦半波パルス	ΔR +/-0.2%
はんだ耐熱性	MIL-STD-202 Method 204	5gを20分, 3方向から12サイクル, 10-20	ΔR +/-0.2%
はんだ濡れ性	MIL-STD-202 Method 210	はんだ温度260°C, 10秒	ΔR +/-0.5%
電気的特性	J-STD-002	J-STD-002 に従う	10倍の倍率で95%以上
短時間過電流負荷	ユーザー仕様	定義された抵抗値	仕様の公差内
低温貯蔵	--	定格電流の5倍を5秒	ΔR +/-0.5%
	--	-65°C, 24時間	ΔR +/-0.2%

発注コード例: SBZ-5216-CM2-R0001-5-U-NP-BK

(例 0.1mΩ SBZ 5216 検出ピンなし、メッキなし、袋詰めで出荷)

